光学学报 ACTA OPTICA SINICA

光学薄膜的气相混合蒸镀

段致平

周九林

(平原光学仪器厂,河南焦作)

(西南技术物理研究所)

提丢

本文论述气相混合蒸镀的实验方法,介绍了三种控制程序,给出了两种宽带增透膜的实验镀制结果。 实验表明,气相混合蒸镀技术具有极大的应用潜力。

一、引 言

早在五十年代,人们对混合薄膜的独特性能就有了一些认识¹¹。

混合轉膜,是指薄膜由两种或两种以上膜料混合而成。混合膜最明显的优越性是,在一 定范围内可以获得任意折射率值,从而大大扩展了薄膜材料的可供利用的范围,使最优化设 计得以实现。适当混合的薄膜,可以改善薄膜的微结构^[20],减小光散射损耗,提高抗激光损 伤阈值。混合膜还可以改善薄膜的应力状态,提高薄膜的机械性能和其他性能^[30]。

混合膜的制备有两种方式。一种是将两种固体膜料均匀混合,置于同一蒸发源中,蒸镀 成膜。另一种是在高真空中的两种膜料从各自的蒸发源同时蒸发,它们的蒸气混合而形成 薄膜。比较起来,前者虽然简单,但要受到很多限制。而气相混合法可以混合的膜料范围极 广,可以获得的折射率数值范围很宽,特别是可以制备折射率沿厚度按预定函数变化的非均 匀薄膜^[47],这给膜系设计引入新的变量,将演化出多姿多彩的新膜系,展示出广阔的应用前 景和丰富的研究课题。

过去由于数学处理的繁难和镀膜设备的限制,气相混合蒸镀并没有得到系统的研究和 广泛的应用。目前电子计算机已普遍使用,配备多个蒸发源、多个石英晶体探头的镀膜机已 成为商品,这使气相混合蒸镀有了坚实的技术基础。

二、实 验

利用半自动化的 BAK 760 型箱式真空镀膜机进行气相混合膜的蒸镀实验。 该机备有 两套电子枪蒸发系统和两组阻热式蒸发器,带有两个石英晶体探测头,可监测蒸发速率和薄 膜的几何厚度。在某些实验中,同时还可利用该机的光学监控系统。本实验采用反射光路, 光束入射角大约为 30°。

气相混合可以有两种方式。一种是恒比例混合,即两种膜料蒸气的淀积速率自始至终 保持某一固定比例,可制得折射率为某一预定值的均匀混合薄膜;另一种是变比例混合,即 两种膜料蒸气的淀积速率之比值随蒸镀时间而变化,可制得折射率沿厚度按预定函数变化

收稿日期: 1987 年6月5日

的非均匀薄膜。

气相混合蒸镀的核心,是精确控制两种膜料的蒸发速率,以及它们之间的预定关系。为 了实现这种控制,可以有多种多样的实验方案。在实验中采用了以下几种方案,或者称之为 几种程序。

程序 1. 两把电子枪同时蒸发,用两个石英探头分别监测各枪的蒸发速率,同时用光学 膜厚监控系统测量混合膜的光学厚度。实验布置如图1所示。

将石英探头安置在真空室的后部, 以免遮挡膜料蒸气对镀件的淀积。 每个探头加置深 度屏蔽,以防止另一蒸气源蒸气混入本源探头。 探头石英片距电子束蒸发源平面的高度为 52 cm (可调)。玻璃监控片位于真空室顶部中心距电子束蒸发源平面的高度为72 cm。

在执行程序1的过程中,ABK760 镀膜机的两台微处理机分别处理来自石英探头的速 率信息,分别控制每把电子枪的蒸发功率。气相混合蒸镀的技巧在于,通过基础实验,调整 各个镀制参数,使蒸发源挡板一经打开,膜料蒸发速率就达到预定值。

用程序1完成了大量的基础实验, 对膜料 MgF₂/TiO₂、SiO₂/TiO₂、Al₂O₃/TiO₃等在各 种条件下(气压、基础温度、混合比)的气相混合蒸镀,进行了比较系统的实验研究。图2给 出了气相混合薄膜 Al₂O₃/TiO₂ 的折射率(633 nm)与混合比的关系。实验镀制的条件是: 基片温度 250°C, 氧压 2.25×10-4 Torr, 基片转速 14 rpm。



of program 1

rate to summary rate

程序2: 双枪同时蒸发,实验布置如图3所示。

在执行程序2的过程中,接收石英探头a信号的微处理机控制 I 枪的蒸发速率,而与探 头 b 相联的微处理机则控制混合膜的总的淀积速率, 以实现预定的气相混合比。实际上, 后 一台微处理机也是通过对 II 枪蒸发功率的控制来获得上述的效果。 探头 b 承担了控制速 率和测量膜厚的双重功能,因此采用可以自动换片的石英探头。实现程序2的一点技巧是, 在两种混合膜料中,I枪坩埚应放入蒸发性能比较稳定的膜料,这样控制起来比较容易。

用程序2测量了TiO。蒸气在真空室不同位置的淀积速率,借以规定自动气相混合工艺



的键盘输入数据,诸如淀积速率 R,膜料密度 M,膜层几何厚度 TH 等等。其他膜料也都可

以进行这样的基础实验。具体做法 是,将TiO,放入I枪坩埚,启动程 序2,令II枪蒸发速率为零,逐步 加大I枪功率,于是两个键盘显示 器便分别显示出石英探头。b的淀 积速率,由此得到它们之间的关系。 这个实验对气相混合蒸镀很有实际 意义,它告诉我们,为了提高气相混 合蒸镀的控制精度,某些参数必须 做适当的修正。程序2是气相混合 蒸镀的基本控制方案。

263

程序 3. 在程序 2 的布置中加 入光学膜厚监控系统,如图 4 所示。

Fig. 3 Schematic experiment arrangement of program 2

其优点在于,同时显示混合薄膜的几何厚度和光学厚度,即在薄膜蒸镀过程中,键盘显示器 显示出几何厚度,而 X-Y 记录仪(W-W312型)描绘出关联着光学厚度的反射率曲线。 运行程序 3 可以得到更多的蒸镀信息,快速简捷地找出镀制参数。



Fig. 4 Schematic experiment arrangement of program 3

三、实 例

下面给出两个宽带增透膜系的实例,它们都是用气相混合蒸镀技术完成的。 膜系的光 学性能用分光光度计 UV-365 测得。

实例1 450~900 nm 宽带增透膜。

基底玻璃折射率为1.51~1.55。 技术指标要求在整个波段内的平均残余反射率 \overline{R} <

1%,并且在 490~880 nm 最大反射率 R_{max} <1.5%。最优化设计的膜系由三种膜料组成, 其中间折射率值为 1.66。应用气相混合蒸镀技术,只需 MgF₂ 和 TiO₂ 两种膜料,并使两者 均匀混合,制得折射率相当精确的(1.66)混合膜层,取代了第三种膜料,成功地完成了整个 膜系的镀制。其实测结果如图 5 所示。

实例2 中间层折射率渐变的三层宽带增透膜。

基底为 K₀ 玻璃: 膜系为 $\lambda_0/4-\lambda_0/2-\lambda_0/4$ 型。邻接玻璃的膜层的折射率 $n_x = 1.75$, 顶层 膜折射率 $n_x = 1.38$, 而中间层膜的折射率从里向外由 $n_x = 2.3$ 逐渐降为 2.0。

应用气相混合蒸镀技术,由 Al₃O₃和 TiO₃ 恒比例混合,制得 n_M=1.75 的 λ₀/4 镀层; 然 后又由 Al₃O₃和 TiO₃ 进行变比例气相混合,即改变两者淀积速率之比,得到了 n_H=2.3→ 2.0 的 λ₀/2 渐变层;最后通过阻热式蒸发 MgF₃, 镀制 λ₀/4 顶层膜。完成这个三层增透膜, 既有均匀混合,又有非均匀混合,几乎演证了气相混合蒸镀的全部内容,是非常有趣的。

图 6 示出该膜系的实测结果。显而易见,从增透膜的宽度、平滑度、带内残余反射率值 来看,传统的三层增透膜是望尘莫及的。





Fig. 5 Spectral reflectance of a broadbard (450~900nm) antireflection coating in which the layers with index 1.66 consisted of vapor-phase mixed MgF₂/TiO₂ films

Fig. 6 Spectral reflectance of a three-layer antireflection coating MHHI where $N_{\rm M}=1.75$, $N_{\rm H}=2.3\rightarrow2.0$, $N_{\rm L}=1.38$. The layer with index 1.75 consisted of a vapor-phase mixed Al₂O₃/TiO₂ film, and the gradient index layer consisted of

a vapor-phase imbomogeneously mixed Al_2O_3/TiO_2 film $a-\lambda_0=584$ nm, $b-\lambda_0=677$ nm

四、结 论

综上所述,可以得到以下结论;

1. 气相混合蒸镀技术有极大的应用潜力。只要我们透彻地研究几种高、低折射率的优质膜料的性能,以及它们混合的相容性(应力、结晶等),那么原则上讲,应用气相混合蒸镀技术,仅用这几种优质膜料就可以制成所有现存膜料能够实现的膜系,还能制成现存膜料所不能实现的膜系。

2. 目前气相混合蒸镀已不是可行性的演证实验,多次实验表明,气相混合蒸镀可以有

很高的重复性,完全能够作为薄膜生产的一种有效镀制方法。

8. 气相混合蒸镀扩充了薄膜制备技术的内容,提出了丰富的新课题,特别是非均匀气 相混合蒸镀,展示了宽阔的前景。

对气相混合膜的应力, 徽结构, 光散射, 以及应用混合膜实现超宽带增透膜这些迫切的 课题, 我们即将专文论述。

李建和、陈现河等同志协助完成了本文所述实验,特致深切的谢意。

参考文献

[1] R. Jacobeson; «in Physics of Thin Films», (G. Hass et al, eds, Academic Press, New York, 1975), 8, 51.

[2] E. N. Farabaugh, D. M. Sanders; J. Vac. Sci. Technol. A, 1983, 1, No. 2 (Apr-Jun), 356.

[3] Т. П. Явовчева, Н. Л. Кутравцева, Г. С. Ходаков; СМП, 1985, вып 8 (Август), 31.

[4] H. Sankur, W. H. Southwell; Appl. Opt. 1984, 23, No. 16 (Aug), 2770.

Vapor-phase mixed deposition of optical coatings

DUAN ZHIPING

(Pingyuan Optical Instrument Plant, Jiaozuo, Henas)

ZHOU JIULIN

(South-West Technical Physics Institute, Chengdu)

(Received 5 June 1987)

Abstract

Two thin-film materials are evaporated simultaneously from respective sources in vacuum where vapor-phase mixed thin films will be formed. Experimental methods are described for the vapor-phase mixed deposition, and three programs for controlling deposition are presented. The experimental results of two broad-band antireflection coatings are given as practical examples. Experiments show that vaporphase mixed deposition is a promising technique for application.